

<<聚合物表面分析>>

图书基本信息

书名：<<聚合物表面分析>>

13位ISBN编号：9787502533977

10位ISBN编号：7502533974

出版时间：2001-11

出版时间：化学工业出版社

作者：布里格斯

译者：曹立礼

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

<<聚合物表面分析>>

内容概要

本书深入论述了X射线光电子谱（XPS）和静态次级离子质谱（SSIMS）及其在聚合物材料研究中的应用。

在聚合物表面的结构分析与特性研究，特别是解决工业研究中有关问题时，XPS和SSIMS普遍被认为是强有力的技术。

随着过去十年仪器分析能力和数据阐释方面的飞速发展，该领域已经发展到有可能将这两方面的信息合并起来的阶段。

本书中，作者叙述了XPS和SSIMS技术，并就各自可获得的住处类型分别作了解释。

本书也包含实际研究细节，强调了在聚合物表面结构研究中，XPS和SSIMS的信息互与联合作用，及其同材料性质的关联。

对那些有志于聚合物表面和表面分析科学工作者、工业研究人员，本书是很有考参价值的。

<<聚合物表面分析>>

书籍目录

第一章 引言

- 1.1 聚合物表面的重要性
- 1.2 聚合物表面和体相的差异
- 1.3 添加剂和污染物的影响
- 1.4 聚合物表面预处理及改性
- 1.5 与表面特性有关的深度范围
- 1.6 聚合物表面分析技术的要求
- 1.7 XPS简要历史
- 1.8 SIMS简要历史

第二章 X射线光电子谱

- 2.1 仪器结构
- 2.2 物理基础

第三章 聚合物的XPS信息

<<聚合物表面分析>>

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>